

LA COMUNIDAD CIENTIFICA INTERNACIONAL SE REUNE

Eduardo Donoso Catalán, académico del Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales, IDIEM, participó en el Congreso de Investigaciones de Microscopía Electrónica. El certamen se efectuó entre los días 16 y 21 de noviembre de 1981, en Bogotá, Colombia.

En la oportunidad el profesor Donoso presentó el trabajo titulado "Influencia de las fases presentes en las características del deslizamiento en una aleación Al-Zn-Mg.

En el mes de noviembre se realizó en Buenos Aires, Argentina, la Octava Asamblea General de la Federación Mundial de Organización de Ingenieros, y una Conferencia Internacional sobre la Formación de Ingenieros.

Asistieron en representación de nuestra Facultad, el Director de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, Rodrigo Flores, y el Subdirector, Isaac Ergas.

Ari Varschavsky, académico del Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales, IDIEM, viajó a la Ciudad de México entre los días 10 al 23 de octubre (de 1981. El objeto del viaje fue asistir a la VII Conferencia Interamericana en Tecnología de Materiales.

El profesor Varschavsky presentó en dicha reunión dos trabajos en colaboración del académico Eduardo Donoso, Además, actuó como Co-Chairman de una Sección de Metalurgia.

Entre los días 30 de noviembre y 4 de diciembre de 1981 se efectuó en Barbados el Primer Seminario Regional sobre "Financiamiento y Energía". En dicho certamen participó el académico del Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica, Efraín Asenjo.

En el Seminario se analizaron fundamentalmente las necesidades y disponibilidades actuales, de posibles alternativas de financiamiento del desarrollo energético, regional y por país.

A Buenos Aires, Argentina, viajó entre los días 30 de noviembre y 11 de diciembre, el profesor del Departamento de Matemáticas y Ciencias de la Computación, Eduardo Engel.

El académico participó con la presentación del trabajo "An Alias-free Sampling Technique", en la Cuadragésima Tercera Reunión del International Statistical Institute.